

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY Nr/No AP 154

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 20 z/of 30.07.2026

 AP 154	Nazwa i adres / Name and address ARKOM-LAB Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 14 35-103 Rzeszów
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.01 długość 6.02 kąt 6.03 długość (geometria powierzchni) 6.04 długość (pomiar współrzędnościowy)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 154 z dnia 30.05.2025 r.
Cykl akredytacji od 16.09.2025 r. do 15.10.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 154 of 30.05.2025
Accreditation cycle from 16.09.2025 to 15.10.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

ARKOM-LAB Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 14, 35-103 Rzeszów				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Płytki wzorcowe kl. 0, 1, 2	0,5 mm do 175 mm	$(0,06 + 0,0007 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> – wielkość mierzona (mm)	S	Procedura wewnętrzna IW-1-LW-AK-01 w oparciu o normę PN-EN ISO 3650:2000 przy użyciu komparatora MAHR oraz płytek wzorcowych klasy K
Pierścienie wzorcowe - średnica pierścienia	0,8 mm do 50 mm 50 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm 200 mm do 300 mm	1,3 μm 1,4 μm 1,5 μm 1,9 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-01 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz pierścieni wzorcowych
Sprawdziany i przeciw sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe - średnica podziałowa	1 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm 200 mm do 300 mm	3,0 μm 3,1 μm 3,4 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-02 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz waleczków pomiarowych
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe - średnica podziałowa	2,4 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm 200 mm do 300 mm	3,1 μm 3,2 μm 3,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-03 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz pierścieni wzorcowych
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe - średnica podziałowa	4 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm	5,0 μm 6,7 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-04 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz pierścieni wzorcowych
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe - średnica podziałowa	4 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm	5,0 μm 6,7 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-05 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz pierścieni wzorcowych
Sprawdziany tłoczkowe - średnica tłoczka	0,2 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm 200 mm do 300 mm	1,0 μm 1,3 μm 1,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-06 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz wzorca tłoczkowego
Sprawdziany pierścieniowe gładkie - średnica pierścienia	0,8 mm do 50 mm 50 mm do 100 mm 100 mm do 200 mm 200 mm do 300 mm	1,3 μm 1,4 μm 1,5 μm 1,9 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-2-LW-AK-07 przy użyciu długościomierza poziomego MAHR oraz pierścieni wzorcowych
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,001 mm	0 mm do 5 mm	0,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK 01 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,002 mm	0 mm do 3 mm	0,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-01 przy użyciu OPTIMAR

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,005 mm	0 mm do 10 mm	0,7 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-01 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm	0 mm do 10 mm	1,2 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-01 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm	10 mm do 100 mm	2,1 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-01 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,1 mm	0 mm do 100 mm	8,3 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-01 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0002 mm	0 mm do 10 mm	0,5 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0002 mm	10 mm do 100 mm	0,7 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0005 mm	0 mm do 10 mm	0,6 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0005 mm	10 mm do 100 mm	0,8 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,001 mm	0 mm do 10 mm	0,6 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,001 mm	10 mm do 100 mm	1,5 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,002 mm	0 mm do 10 mm	1,3 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,002 mm	10 mm do 100 mm	1,4 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,005 mm	0 mm do 10 mm	1,3 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,005 mm	10 mm do 100 mm	1,4 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,01 mm	0 mm do 10 mm	1,8 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm	10 mm do 100 mm	2,1 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,02 mm	0 mm do 10 mm	5,8 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,02 mm	10 mm do 100 mm	5,9 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,05 mm	0 mm do 100 mm	14,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,1 mm	0 mm do 100 mm	28,9 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,2 mm	0 mm do 100 mm	57,8 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-02 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,001 mm	0 mm do 0,6 mm	0,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-03 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,002 mm	0 mm do 1,2 mm	0,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-03 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,01 mm	0 mm do 3 mm	1,2 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-03 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,02 mm	0 mm do 2 mm	1,7 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-03 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,001 mm	0 mm do 2 mm	0,7 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-04 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,01 mm	0 mm do 2 mm	1,2 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-04 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0002 mm	-0,015 mm do 0,015 mm	0,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0005 mm	-0,025 mm do 0,025 mm	0,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,001 mm	-0,10 mm do 0,10 mm	0,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,002 mm	-0,13 mm do 0,13 mm	0,5 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,005 mm	-0,20 mm do 0,20 mm	0,7 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,01 mm	-1,0 mm do 1,0 mm	1,0 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,05 mm	-1,5 mm do 1,5 mm	4,1 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,1 mm	-4,0 mm do 4,0 mm	8,2 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-3-LW-AK-05 przy użyciu OPTIMAR
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowe	2 mm do 100 mm 100 mm do 300 mm	2,3 μ m 2,8 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-8-LW-AK-01 przy użyciu pierścieni wzorcowych
Sita	0,02 mm do 25 mm 25 mm do 125 mm	4 μ m 8 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-02 w oparciu o PN-ISO 3310-1:2000 PN-ISO 3310-2:2000 PN-ISO 3310-3:2000 PN-EN 933-3:2012 ASTM E11-24 pomiar przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Suwmiarki	0 mm do 150 mm 0 mm do 300 mm 0 mm do 500 mm 0 mm do 600 mm 0 mm do 800 mm 0 mm do 1000 mm	14 μ m 15 μ m 17 μ m 20 μ m 20 μ m 22 μ m	S	PN-EN ISO 13385-1:2019
Wysokościomierze suwmiarkowe	0 mm do 150 mm 0 mm do 300 mm 0 mm do 500 mm 0 mm do 600 mm 0 mm do 800 mm 0 mm do 1000 mm	14 μ m 15 μ m 17 μ m 20 μ m 20 μ m 22 μ m	S	PN-EN ISO 13225-1:2020
Głębokościomierze suwmiarkowe	0 mm do 150 mm 0 mm do 300 mm 0 mm do 500 mm	14 μ m 15 μ m 17 μ m	S	PN-EN ISO 13385:2020
Mikrometry zewnętrzne	0 mm do 25 mm 25 mm do 50 mm 50 mm do 75 mm 75 mm do 100 mm 100 mm do 125 mm 125 mm do 150 mm 150 mm do 175 mm 175 mm do 200 mm 200 mm do 225 mm 225 mm do 250 mm 250 mm do 275 mm 275 mm do 300 mm 300 mm do 325 mm 325 mm do 350 mm 350 mm do 375 mm 375 mm do 400 mm 400 mm do 425 mm 425 mm do 450 mm 450 mm do 475 mm 475 mm do 500 mm	1,0 μ m 1,2 μ m 1,5 μ m 1,8 μ m 2,1 μ m 2,4 μ m 2,7 μ m 3,0 μ m 3,4 μ m 3,7 μ m 4,1 μ m 4,4 μ m 4,7 μ m 5,1 μ m 5,4 μ m 5,7 μ m 6,1 μ m 6,4 μ m 6,8 μ m 7,1 μ m	S	PN-EN ISO 3611:2023

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Mikrometry wewnętrzne	5 mm do 100 mm	2,3 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-01 przy użyciu pierścieni wzorcowych
Głębokościomierze mikrometryczne	0 mm do 25 mm 25 mm do 50 mm 50 mm do 75 mm 75 mm do 100 mm 100 mm do 125 mm 125 mm do 150 mm 150 mm do 175 mm 175 mm do 200 mm 200 mm do 225 mm 225 mm do 250 mm 250 mm do 275 mm 275 mm do 300 mm 300 mm do 325 mm 325 mm do 350 mm 350 mm do 375 mm 375 mm do 400 mm 400 mm do 425 mm 425 mm do 450 mm 450 mm do 475 mm 475 mm do 500 mm	1,0 μm 1,2 μm 1,5 μm 1,8 μm 2,1 μm 2,4 μm 2,7 μm 3,0 μm 3,4 μm 3,7 μm 4,1 μm 4,4 μm 4,7 μm 5,1 μm 5,4 μm 5,7 μm 6,1 μm 6,4 μm 6,8 μm 7,1 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-11-LW-AK-01 przy użyciu płytek wzorcowych
Głębokościomierze czujnikowe z odczytem analogowym o wartości działki elementarnej: - 0,001 mm - 0,002 mm - 0,005 mm - 0,01 mm - 0,1 mm	0 mm do 5 mm 0 mm do 5 mm 0 mm do 10 mm 0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 100 mm	0,6 μm 0,6 μm 0,7 μm 1,2 μm 2,1 μm 8,3 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-6-LW-AK 01 przy użyciu OPTIMAR oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Głębokościomierze czujnikowe z odczytem cyfrowym o rozdzielczości: - 0,0002 mm - 0,0005 mm - 0,001 mm - 0,002 mm - 0,005 mm - 0,01 mm - 0,02 mm - 0,05 mm - 0,1 mm - 0,2 mm	0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 10 mm 10 mm do 100 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 100 mm	0,5 μm 0,7 μm 0,5 μm 0,7 μm 0,6 μm 1,5 μm 1,3 μm 1,4 μm 1,3 μm 1,4 μm 1,8 μm 2,1 μm 5,9 μm 14,5 μm 28,9 μm 57,8 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-6-LW-AK 01 przy użyciu OPTIMAR oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Grubościomierze czujnikowe z czujnikiem analogowym o wartości o działki elementarnej: - 0,001 mm - 0,002 mm - 0,005 mm - 0,01 mm - 0,1 mm	0 mm do 5 mm 0 mm do 10 mm 0 mm do 10 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 75 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 25 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 75 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 60 mm 0 mm do 100 mm	1,0 µm 1,0 µm 1,1 µm 1,3 µm 1,5 µm 1,8 µm 1,5 µm 1,6 µm 1,8 µm 2,0 µm 5,9 µm 6,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-02 przy użyciu płytek wzorcowych
Grubościomierze czujnikowe z czujnikiem cyfrowym o rozdzielczości: - 0,001 mm - 0,002 mm - 0,005 mm - 0,01 mm	0 mm do 25 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 75 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 25 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 75 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 75 mm 0 mm do 100 mm 0 mm do 50 mm 0 mm do 100 mm	1,2 µm 1,4 µm 1,6 µm 1,9 µm 1,6 µm 1,7 µm 1,9 µm 2,1 µm 3,2 µm 3,3 µm 3,4 µm 5,9 µm 6,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-02 przy użyciu płytek wzorcowych
Macki zewnętrzne	0 mm do 200 mm	3,5 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-03 przy użyciu płytek wzorcowych
Macki wewnętrzne	2 mm do 25 mm 25 mm do 50 mm 50 mm do 75 mm 75 mm do 100 mm 100 mm do 150 mm 150 mm do 200 mm 200 mm do 250 mm 250 mm do 300 mm	1,1 µm 1,3 µm 1,5 µm 1,8 µm 2,3 µm 3,0 µm 3,7 µm 4,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-03 przy użyciu płytek wzorcowych
Szczelinomierze listkowe	0,01 mm do 10,00 mm	4,9 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-04 przy użyciu mikrometru cyfrowego
Kątowniki 90° dwuramienne pomiar odchyłki - płaskości - prostoliniowości - równoległości - prostokątności	długość ramienia do 500 mm	4,2 µm 4,2 µm 4,2 µm 4,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-03 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Kątowniki walcowe 90° pomiar odchyłki - prostoliniowości - prostokątności	0 mm do 400 mm	4,2 µm 4,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-04 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Średnicówki czujnikowe czujnikiem analogowym o wartości działki elementarnej:			S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-05 przy użyciu płytek wzorcowych
- 0,001 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	3,7 µm 3,8 µm 4,3 µm 5,2 µm 7,9 µm		
- 0,002 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	3,7 µm 3,8 µm 4,3 µm 5,2 µm 7,9 µm		
-				
0,005 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	3,8 µm 3,8 µm 4,4 µm 5,2 µm 7,9 µm		
- 0,01 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	4,4 µm 4,4 µm 4,9 µm 5,7 µm 8,2 µm		
- 0,1 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	10,8 µm 10,9 µm 11,0 µm 11,4 µm 12,9 µm		
Średnicówki czujnikowe z cyfrowym czujnikiem o rozdzielczości:			S	Procedura wewnętrzna IW-10-LW-AK-05 przy użyciu płytek wzorcowych
- 0,001 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	4,1 µm 4,2 µm 4,7 µm 5,5 µm 8,1 µm		
- 0,002 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	4,2 µm 4,3 µm 4,8 µm 5,6 µm 8,2 µm		
- 0,005 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	5,0 µm 5,1 µm 5,5 µm 6,2 µm 8,6 µm		
- 0,01 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	7,2 µm 7,2 µm 7,5 µm 8,0 µm 10,0 µm		
- 0,02 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	13,5 µm 13,6 µm 13,7 µm 14,00 µm 15,2 µm		
- 0,05 mm	0 mm do 35 mm od 35 mm do 60 mm od 50 mm do 150 mm od 150 mm do 250 mm od 250 mm do 500 mm	32,7 µm 32,7 µm 32,8 µm 32,9 µm 33,5 µm		

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC ($40,2 + 12,1 \cdot L$) μm <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Przymiary sztywne	0 mm do 750 mm	($40,2 + 12,1 \cdot L$) μm <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-06 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Przymiary półsztywne	0 mm do 750 mm	($40,2 + 22,2 \cdot L$) μm <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-06 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Wzorce kreskowe lup pomiarowych	0 mm do 20 mm	3,6 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-08 pomiar przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Szczelinomierze klinowe	0 mm do 50 mm	29,4 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-12 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Sprawdziany stożkowe do otworów	0 mm do 200 mm	20,0 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-11 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Spoinomierze - suwmiarkowe - specjalne	0 mm do 50 mm 0 mm do 60 mm	16,7 μm 16,7 μm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-09 IW-9-LW-AK-10 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Kąt				
Sprawdziany specjalne	0° do 360°	48''	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-01 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Kątomierze uniwersalne analogowe	4x90°	2,8'	S	Procedura wewnętrzna IW-11-LW-AK-03 przy użyciu płytek kątowych
Kątomierze uniwersalne cyfrowe	0° do 360°	2,5'	S	Procedura wewnętrzna IW-11-LW-AK-03 przy użyciu płytek kątowych
Poziomnice cyfrowe	4x90°	0,04°	S	Procedura wewnętrzna IW-11-LW-AK-04 przy użyciu płytek kątowych

Wersja strony: A

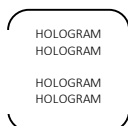
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Spoinomierze - suwmiarkowe - specjalne (pomiar kąta ukosowania)	60° do 90° do 160°	5' 11" 5' 11"	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-09 IW-9-LW-AK-10 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Kątowniki dwuramienne specjalne	0° do 360°	48"	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-05 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Długość (geometria powierzchni)				
Płyty pomiarowe - odchylenie od płaskości	długość dłuższego boku 250 mm 400 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm	1,2 µm 1,7 µm 1,8 µm 2,8 µm 2,7 µm 3,0 µm 3,3 µm 3,8 µm 4,3 µm 4,8 µm 5,3 µm	S, P	Procedura wewnętrzna IW-4-LW-AK-01 przy użyciu poziomnic różnicowych Talyvel 6
Liniały krawędziowe	0 mm do 750 mm	2,6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-07 przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect
Długość (pomiar współrzędnościowe)				
Sprawdziany specjalne - długość - szerokość - średnica - odchyłka kształtu - odchyłki położenia	0 mm do 600 mm 0 mm do 400 mm 0 mm do 250 mm 0 mm do 1 mm 0 mm do 600 mm	4,2 µm 4,2 µm 4,2 µm 3,0 µm 4,1 µm	S	Procedura wewnętrzna IW-9-LW-AK-01 pomiar przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej O-Inspect

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 154

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 30.07.2026 r.